	arc	 	_	

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/792,237	FUJITA ET AL.
Examiner	Art Unit
Philip R. Smith	3739

	SEAR	CHED		
Class	Subclass	Date	Examiner	
600	103, 109, 117, 118, 160	12/11/2006	PRS	
	•	:		
:				
		: :		
1		·		
· · ·	,	:		
1 : .				
			,	
			;	
<u>:</u>				

IN	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
<u></u>					
	·				

(INCLUDING SEARCH STRATEGY)						
	:		<u> </u>	DATE	EXMR.	
•		•				
	:					
EAST text search				12/11/2006	PRS	
-	: :		: ;			
•	: :		·· ,			
		:	; ;			
	•		. ;			
	: :			: .		
		<u>.</u>				
:	i		:			
		:	. :			
			: :			
	:		; ;			
			:	: :		
	:			<u> </u> ,		
:	:					
•			:	:		
·····						
:	: :		: :			
•						
•				. : :		
			. !			
			:			
	: .					
			:			
			:			
	:					
	· .		• :	<u> </u>		